平成 18 年 11 月 8 日

委員各位

（独）日本学術振興会
情報科学用有機材料 142 委員会
委員長　小出　直之
C 部会主査　安達　千波矢

情報科学用有機材料第 142 委員会
「有機光エレクトロニクス部会　第 18 回研究会」開催通知

―有機薄膜関連の測定技術―

近年、有機 EL、有機トランジスタに代表される有機半導体デバイスの研究開発が活発に行われています。これら有機半導体デバイスを構成する有機薄膜や界面の測定は物理現象の解明と合わせてデバイス特性の向上の為にも大変重要な意味を持ちます。今回は、様々な角度から有機薄膜の測定技術に関する研究成果を第一線の研究者の方々にご紹介して頂きます。皆様ふるってご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

１．日時：平成 18 年 12 月 19 日（火）　13:00-17:00
２．場所：東京理科大学　森戸記念館
東京都新宿区神楽坂 4-2-2
（JR・地下鉄「飯田橋」下車、徒歩約 5 分）
http://www.tus.sc.jp/info/setubi/morito.html

３．研究会プログラム：（敬称略）
１）「熱刺激電流法による有機半導体の測定」　（13:00-13:45）
株式会社リガク応用技術センター　平山　泰生

２）「大気中光電子分光法による有機薄膜の測定」　（13:45-14:30）
理研計器株式会社研究部　中島　嘉之

３）「正逆光電子分光を用いた有機物質の電子構造の解明」　（14:30-15:15）
名古屋大学理学研究科　金井　要

（休　憩）

４）「分光計測装置を用いた発光材料の光物理過程の解明」　（15:30-16:15）
浜松ホトニクス株式会社システム事業部　鈴木　健吾

５）「ケルビンプローブ原子間力顕微鏡による有機分子/金属界面の物性評価」（16:15-17:00）
京都大学工学研究科　山田　啓文

（追記）：準備の都合がありますので、出席のご都合を同封の解答用紙で 12 月 4 日（月）までにお知らせください。